

EPMA・表面分析 ユーザーズミーティング

プログラム

09: 30～	受付
10: 00～10: 10	開会挨拶
10: 10～10: 40	樹脂材料の分析困っていませんか？ ～樹脂めっきの EPMA 分析～ 日本電子株式会社 SA 事業ユニット SA 技術開発部 上條 栞
10: 40～11: 15	溶射による厚膜コーティング技術の概要と皮膜組織解析 黒田コーティング技研 黒田 聖治 様
11: 15～11: 50	EPMA を用いた火山噴出物の分析事例紹介 国立大学法人 東北大学 新谷 直己 様
11: 50～12: 20	昼食
12: 20～13: 00	実機・ポスター展示
13: 00～13: 35	artience 株式会社における機器ライセンス制度の紹介と XRF の活用事例 artience 株式会社 加々尾 哲 様
13: 35～14: 05	ICP より超簡単！XRF による液体分析最前線 日本電子株式会社 SA 事業ユニット SA 技術開発部 村谷 直紀
14: 05～14: 35	SXES 分析をより便利に、より簡単に ～使いやすくなった新 SXES ソフトウェアのご紹介～ 日本電子株式会社 SA 事業ユニット SA 設計部 木下 真吾
14: 35～15: 15	休憩 / 実機・ポスター展示
15: 15～15: 45	Ar イオンを利用した試料前処理と加工ダメージの検討 ～半導体試料の AES 分析に向けて～ 日本電子株式会社 SA 事業ユニット SA 技術開発部 鍋島 冬樹
15: 45～16: 15	現場で使える EPMA テクニック ～カラーマップ編～ 日本電子株式会社 ソリューション開発センター ソリューション推進部 土門 武
16: 15～16: 25	閉会挨拶
16: 25～18: 00	懇親会 / 実機・ポスター展示

* プログラムは予告無く変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。よろしくお願い申し上げます。